

# DIN 50451-3:2014-11 (D)

## Prüfung von Materialien für die Halbleitertechnologie - Bestimmung von Elementspuren in Flüssigkeiten - Teil 3: Bestimmung von 31 Elementen in hochreiner Salpetersäure mittels ICP-MS

---

Inhalt	Seite
Vorwort .....	3
1 Anwendungsbereich .....	4
2 Normative Verweisungen .....	4
3 Begriffe .....	4
4 Einheiten .....	4
5 Kurzbeschreibung des Verfahrens .....	5
5.1 Allgemeines .....	5
5.2 Direkte Messung bzw. Messung nach Verdünnung .....	5
5.3 Probenvorbereitung durch Abdampfen .....	5
6 Reagenzien .....	5
7 Geräte und Reinigung .....	5
7.1 Geräte .....	5
7.2 Reinigungsverfahren für Gefäße und Pipettenspitzen .....	6
8 Probenahme und Probenvorbereitung .....	6
8.1 Probenahme .....	6
8.2 Vorbereitung der direkten Messung .....	6
8.3 Probenvorbereitung durch Abdampfen .....	6
9 Herstellen der Nullwertlösungen und Blindwertprobe .....	6
10 Durchführung .....	7
10.1 Messung .....	7
10.2 Kalibrierung .....	7
11 Berechnung und Angabe der Ergebnisse .....	7
12 Präzision und Richtigkeit des Verfahrens und der Prüfergebnisse .....	7
13 Prüfbericht .....	10
Anhang A (informativ) Ergebnisse der Ringversuche .....	11
Literaturhinweise .....	19